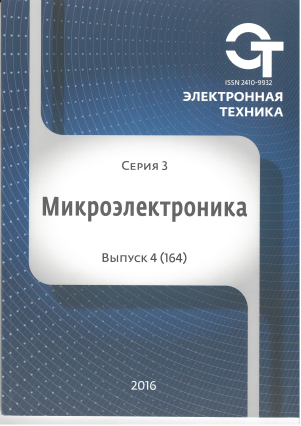
ИНФОРМАЦИЯ О ЖУРНАЛЕ

Журнал «Микроэлектроника» основан в 1965 г. Издательство возобновлено в 2014 году под названием «Электронная техника. Серия 3. Микроэлектроника». Он посвящён технологическим, физическим и схемотехническим аспектам микро- и наноэлектроники. Особое внимание уделяется новым тенденциям в литографии (оптической, рентгеновской, электронной, ионной), травлению, легированию, осаждению и планаризации на субмикронном и нанометровом уровнях. Значительное место отводится плазменным технологиям, молекулярно-пучковой эпитаксии и сухому травлению, а также методам исследования и контроля поверхностей и многослойных структур. Обсуждаются вопросы приборно-технологического моделирования и диагностики технологических процессов в реальном времени. Публикуются статьи о полупроводниковых приборах на базе новых физических явлений, таких как квантовые размерные эффекты и сверхпроводимость. Данное направление исследований охватывает гетероструктуры, нанотранзисторы и полупроводниковые приборы, квантовые биты (кубиты). Рассматриваются проблемы анализа и синтеза электронных схем на биполярных и полевых транзисторах, в частности КМОП- и БиКМОП-схем. Журнал предназначен для специалистов научно-исследовательских институтов, высших учебных заведений и производственно-контрольных лабораторий, а также для аспирантов.

**Основные тематические разделы журнала:**

* Физические явления, расчет и конструирование полупроводниковых приборов;
* Разработка и технологии изготовления полупроводниковых устройств;
* Технологии сборки;
* Специальное технологическое и измерительное оборудование для производства полупроводниковых устройств;
* Свойства материалов, применяемых при изготовлении полупроводниковых устройств и их взаимосвязь с параметрами приборов, размерным фактором и технологическими нормами;
* Параметры и методы измерения;
* Контроль качества и надежности;
* Математическое моделирование в применении к микро-и наноэлектронике;
* Применение, экономика и организация производства полупроводниковых приборов.

**Основные рубрики:**

1. Физические явления
2. Разработка и конструирование
3. Экономика и организация производства
4. Процессы и технология
5. Свойства материалов
6. Технологическое и измерительное оборудование
7. Математическое моделирование
8. Надежность
9. Работы студентов

Журнал издается в бумажном варианте на русском языке с заголовками и аннотациями на английском языке, а также имеет электронную версию оглавления всех вышедших с 2014 года журналов и краткие аннотации опубликованных в них работ, представленном в свободном доступе на сайте журнала [http://www.niime.ru/zhurnal-mikroelektronik***a***](http://www.niime.ru/zhurnal-mikroelektronika), а также в национальной электронной библиотеке <http://elibrary.ru/defaultx.asp>

**Периодичность:** ежеквартальная.

**Объем:** 90–110 страниц.

**Формат:** А4, тираж: 500 экз.

**ISSN**2410-9932

**Международное наименование:** ELECTRONIC ENGINEERING. Series 3. MICROELECTRONICS

**EAN-13:** 9772076424028

**Учредитель:** АО «Научно-исследовательский институт молекулярной электроники»

**Адрес учредителя:** 124460 г. Москва, Зеленоград, 1-й Западный проезд, дом 12, стр.1 Тел.8 (831) 439-09-43

E-mail: [globalsales@mikron.ru](mailto:globalsales@mikron.ru)

Издание зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций (свидетельство о государственной регистрации от 14 августа 2013 г. ПИ № ФС77-55092).

**Подписной индекс:** 80408 в каталоге ОАО Агентство «Роспечать»

Журнал включен  в список периодических изданий, рекомендованных ВАК для публикации основных результатов кандидатских и докторских диссертаций.

Журнал входит в библиографические и реферативные базы РИНЦ.

Все поступающие в редакцию статьи обязательно рецензируются. Рецензентами выступают члены редакционной коллегии и привлекаемые специалисты в областях науки и производства, связанных с микро- и наноэлектроникой*.*

На данный момент в журнале опубликовано более 113 статей, преобладающее большинство которых подготовлено высококвалифицированными российскими и зарубежными учеными и специалистами. Публикации цитируются такими передовыми вузами, как, например, [Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова](javascript:main_page(%22cit_title_items.asp?id=41329&orgsid=2541%22)), [Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ](javascript:main_page(%22cit_title_items.asp?id=41329&orgsid=353%22)), [Институт проблем проектирования в микроэлектронике РАН](javascript:main_page(%22cit_title_items.asp?id=41329&orgsid=5323%22)), [Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)](javascript:main_page(%22cit_title_items.asp?id=41329&orgsid=665%22)) и многими другими. В перспективе журнал планирует увеличить число региональных авторов, расширяя прямые контакты с региональными учебными заведениями и научными институтами.

**Адрес редакции:** 124460 г. Москва, Зеленоград, 1-й Западный проезд, дом 12, стр. 1; тел.: +7 (495) 229-70-43;

e-mail: [journal\_EEM-3@mikron.ru](mailto:journal_EEM-3@mikron.ru); website: http://www.niime.ru/zhurnal-mikroelektronika/